

в одинаковое число раз зарядов всех атомов решетки (изменения зарядовой контрастности решетки). Однако это приводит к очевидной неоднозначности трактовки, и поэтому для определения места локализации дырки мы решили воспользоваться сравнением отношений  $P^0 = (e^2 qQ)_x / (e^2 qQ)_{x=0.1}$  и  $P = (q_{kp})_x / (q_{kp})_{x=0.1}$ , поскольку указанные отношения не должны зависеть ни от выбора  $\gamma$ , ни от зарядовой контрастности решетки. На рис. 2 приведены зависимости  $P(x)$  для узлов меди, причем расчет проведен для четырех моделей: дырка находится в подрешетке Cu, в подрешетке O(1), в подрешетке O(2) и одновременно в подрешетках O(1), O(2). Как видно из рис. 2, уменьшение  $e^2 qQ$  с ростом  $x$  для центров  $^{67}\text{Zn}^{2+}$  и  $^{57}\text{Fe}^{3+}$  может быть количественно объяснено, если дырка локализуется в подрешетке O(2) (или преимущественно в этой подрешетке).

### Список литературы

- [1] Seregin P. P., Nasredinov F. S., Masterov V. F., Daribaeva G. T. // Phys. Stat. Sol. (b). 1990. V. 159. P. K97—K101.
- [2] Yoshimura K., Imai T., Shimizu T., Ueda Y., Kosuge K., Yasuoka H. // J. Phys. Soc. Jap. 1989. V. 58. P. 3057—3060.
- [3] Jha S., Mitros C., Lahamer A., Yehia S., Julian M., Dunlap K. A., Stroink G., Stadnik Z. M. // Hyperfine Interact. 1989. V. 50. P. 607—612.
- [4] Sternheimer R. M. // Phys. Rev. 1966. V. 146. P. 140—160.
- [5] Fuller G. H., Cohen V. W. // Nucl. Data V. 1969. V. A5. P. 433—467.
- [6] Gupta R. P., Sen S. K. // Phys. Rev. A. 1973. V. 8. P. 1169—1172.
- [7] McNab T. K., Barrett P. H. Mössbauer Effect Methodology. 1971. V. 7. P. 59—78.
- [8] Yvon K., Francois M. // Z. Phys. B. 1989. V. 76. P. 413—444.
- [9] Tarascon J. M., Grene L. H., McKinnon W. P., Hull G. W., Geballe T. H. // Science 1987. V. 235. P. 1373—1376.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе РАН  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
1 ноября 1991 г.

УДК 536.424.1

© Физика твердого тела, том 34, № 4, 1992  
Solid State Physics, vol. 34, N 4, 1992

## ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В $\text{Ag}_x\text{TiS}_2$ СТАДИИ 2

A. H. Титов, X. M. Биккин

Настоящая работа посвящена изучению фазовых переходов в  $\text{Ag}_x\text{TiS}_2$  ( $0.19 < x < 0.23$ ) стадии 2 в интервале температур 300—880 К. С этой целью были проведены исследования температурной зависимости эдс ( $E$ ) электрохимической ячейки  $\text{Ag}/\text{AgI}/\text{Ag}_x\text{TiS}_2/\text{Pt}$ , электропроводности на постоянном токе  $\sigma$ , коэффициента Зеебека  $\alpha$ . Использовались также методы дериватографии и рентгенографии.

Методика получения материала и контроля его состава описана в [1]. Измерения проводили стандартными методами в атмосфере очищенного азота. Дериватографические исследования были выполнены на модернизированном дериватографе Q-1500P [2]. Для исследований применяли образцы, запаянные в откаченные до  $10^{-5}$  мм рт. ст. пирексовые ампулы. По результатам измерений обнаружены 2 фазовых перехода, не описанных ранее в литературе.

Особенности на кривой  $I$  рис. 1 при 420 и 540 К, указывающие на скачкообразное уменьшение теплоемкости образца, могут рассматриваться как свидетельство фазовых переходов при этих температурах. На зависимостях  $E(T)$  (рис. 1) вблизи 540 К также наблюдаются характерные изломы, которые можно

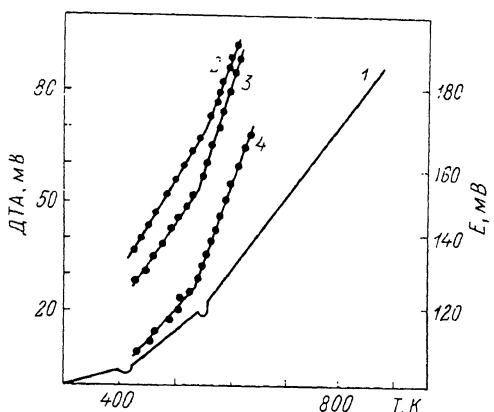


Рис. 1. Зависимость сигнала ДТА от температуры (1) и температурные зависимости эдс ячейки  $\text{Ag}/\text{AgI}/\text{Ag}_x\text{TiS}_2/\text{Pt}$   $x = 0.20$  (2), 0.21 (3), 0.22 (4).

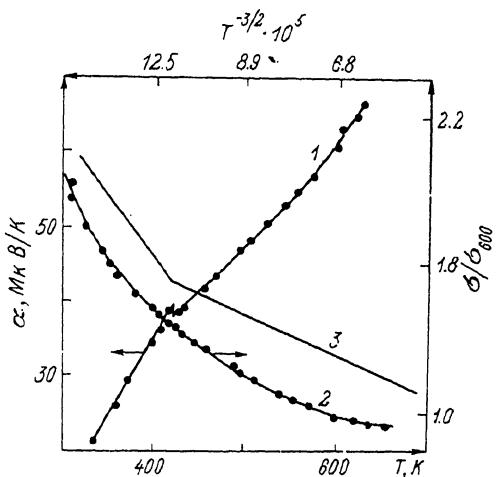


Рис. 2. Зависимость коэффициента Зеебека от температуры (1) и зависимости электропроводности от температуры  $T$  (2) и от  $T^{-3/2}$  (3).

Кривая  $\sigma (T^{-3/2})$  смещена для наглядности вверх. Типичная температурная зависимость проводимости  $\text{Ti}_{1+x}\text{S}_2 \sigma (T) = \sigma_0 + AT^{-3/2}$  [6]. Все зависимости приведены для состава  $\text{Ag}_{0.21}\text{TiS}_2$ ; для других составов зависимости аналогичны из-за узкой области гомогенности.

интерпретировать как скаккообразное возрастание энтропии  $S$ , учитывая, что  $\partial E / \partial T = S$ , где  $S$  — энтропия атома серебра в  $\text{Ag}_x\text{TiS}_2$ .

Тот факт, что зависимости  $\alpha (t)$  и  $\sigma (T)$  (рис. 2) остаются плавными функциями при 540 К, а при 420 К производные  $\partial\alpha(T)/\partial T$  и  $\partial\sigma(Z)/\partial Z$ , где  $Z = T^{-3/2}$ , испытывают скачок, позволяет предположить, что переход при 540 К связан с разупорядочением подрешетки ионов серебра. Как следует из результатов работ [3—5] и подтверждается нашими исследованиями, на рентгенограммах образцов  $\text{Ag}_x\text{TiS}_2$  при  $T > 300$  К наблюдаются сверхструктурные рефлексы, свидетельствующие о гексагональном упорядочении атомов серебра в слое с параметром  $a = a_0\sqrt{3}$ , где  $a_0$  — кристаллографический параметр  $\text{Ag}_x\text{TiS}_2$ . Очевидно, что корреляция между образованными таким образом плоскими сетками из атомов серебра в соседних слоях может приводить к удвоению или утроению кристаллографического параметра  $c$  в зависимости от соотношения между корреляционной длиной  $\delta$  и расстоянием  $l$  между ближайшими сетками атомов серебра. Если  $\delta \sim l$ , то следует ожидать удвоения периода, а если  $\delta \sim 2l$ , то утройства.

Наблюдаемый при  $T = 540$  К переход, по нашему мнению, может быть связан с уменьшением корреляционной длины при нагревании. В пользу этого предположения говорят результаты рентгенографических исследований образца состава  $\text{Ag}_{0.21}\text{TiS}_2$  ( $x = 0.21$  — состав, близкий к середине области гомогенности стадии 2) при комнатной температуре. На рентгенограмме (ДРОН-3М,  $\text{CuK}_\alpha$ , графитовый монохроматор) наблюдаются рефлексы с межплоскостными расстояниями 11.54, 6.15, 5.985 и 5.867 Å, которым можно приписать индексы (002), (003), (004), и (100) соответственно, для параметров элементарной ячейки  $a = a_0\sqrt{3} = 3.405$  Å и  $c = 2c_0 = 23.93$  Å, где  $a_0$  и  $c_0$  — параметры элементарной ячейки  $\text{Ag}_x\text{TiS}_2$  стадии 2.

Кроме того, чтобы окончательно убедиться в существовании сверхструктуры  $c = 2c_0$ , была проведена съемка по точкам с экспозицией 100 с и шагом 0.1° в интервале углов 2—5° образца с текстурой вдоль кристаллографической оси  $c$  и без текстуры. В результате был обнаружен один размытый рефлекс с меж-

плоскостным расстоянием  $d = 24.7 \text{ \AA}$ , индуцируемый как (001) для  $c = 2c_0$ , который для образца с текстурой, как и следовало ожидать, намного интенсивнее.

Приведенные результаты, на наш взгляд, указывают на наличие при комнатной температуре в  $\text{Ag}_x\text{TiS}_2$  стадии 2 сверхструктуры  $a_0\sqrt{3} \times a_0\sqrt{3} \times 2c_0$ , которая при нагревании выше 540 К переходит в сверхструктуру  $a_0\sqrt{3} \times a_0\sqrt{3} \times c_0$ , и позволяют оценить величину энергии корреляции атомов серебра в соседних слоях  $E \approx kT = 0.046 \text{ эВ}$ .

Что касается перехода при 420 К, то результаты измерений показывают, что он оказывается на электронной подсистеме  $\text{Ag}_x\text{TiS}_2$ . Следовательно, он может быть связан либо с электронным фазовым переходом, либо с изменениями в фононном спектре. Второе предположение кажется более вероятным, поскольку при данном переходе  $\sigma(T)$  ведет себя плавно, а аномалия появляется только на  $\sigma(Z)$ , где  $Z = T^{-3/2}$ . В этом случае переход при 420 К может быть связан с исчезновением при нагревании одной из дополнительных колебательных мод, наличие которых отмечалось в [4].

Это предположение подтверждается также практически полным отсутствием зависимости температуры этого перехода от состава образца в пределах области гомогенности стадии 2.

#### Список литературы

- [1] Титов А. Н., Биккин Х. М. // ФТТ. 1991. Т. 33. № 6 (в печати).
- [2] Слуднов С. Г., Суевалов С. А., Солнцев В. Д. // Информ. листок № 379-90. Свердловск, 1990. 4 с.
- [3] Scholz G. A., Frindt R. F. // Mater. Res. Bull. 1980. V. 19. N 12. P. 1703—1716.
- [4] Unger W. K., Reyes J. M., Singh O., Curzon A. E., Irwin J. C., Frindt R. F. // Solid State Commun. 1978. V. 28. P. 109—113.
- [5] Oshima K.-J., Moss S. C. // Acta Cryst. 1983. V. A39. P. 298—305.
- [6] Wilson J. A. // Phys. Stat. Sol. (b). 1978. V. 86. N 11. P. 11—36.

Уральский государственный университет  
им. А. М. Горького  
Свердловск

Поступило в Редакцию  
4 июня 1991 г.  
В окончательной редакции  
4 ноября 1991 г.

УДК 535.361

© Физика твердого тела, том 34, № 4, 1992  
*Solid State Physics, vol. 34, N 4, 1992*

## ДВУХФОТОННО-ВОЗБУЖДАЕМАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В КРИСТАЛЛАХ ПАРАТЕЛЛУРИТА

B. С. Горелик, A. M. Агальцов, B. N. Моисеенко

При большой интенсивности возбуждающего излучения в ряде кристаллов наблюдались эффекты двухфотонного поглощения (ДП) [1], двухфотонно-возбуждаемой люминесценции (ДВЛ) [2] и суперлюминесценции (СЛ) [3]. Указанные нелинейно-оптические эффекты могут служить источником ценной информации о примесных состояниях, электронных и колебательных возбуждениях в объеме кристалла. В частности, спектр ДВЛ несет в себе информацию о зонной структуре кристаллов, характере межзонных переходов. Особенно это ценно для диэлектрических кристаллов. Однако возможность наблюдения ДВЛ в диэлектрических кристаллах ограничивается большей вероятностью безызлучательных переходов по сравнению с вероятностью излучательной рекомбинации.